## <sup>2015/08/16 岡山ユーザーズミーティング @国立天文台</sup> <u>極限補償光学装置:</u> <u>点源回折干渉計方式波面センサの開発</u>

## 山本広大 松尾太郎、木野勝(京都大)、今田大皓(筑波大)

京大岡山3.8m望遠鏡の観測対象の一つ 年間100晩太陽系外惑星の直接撮像観測 →0".1で10<sup>7</sup>のコントラストが必要 (木星質量の惑星を検出)

惑星撮像装置SEICAを開発中。 搭載される極限補償光学装置の 波面センサを検討する。 SEICA (ExAO+ コロナグラフ

京大岡山3.8m望遠鏡





- 参照光と被検光の干渉で位相差(波面形状)を測定
   位相差なので最大[-π: π]の測定 (unwrappingで範囲拡大)
- 参照光(or 被検光)に位相シフト(0, π, π/2, -π/2)を与えて干渉させる

位相シフトの与え方

- 時間的な変調
- 偏光を利用



+振幅を加えて複素振幅の測定&補償 →より高いコントラストの観測が可能に。

後述





サバール板 偏光方向によって光線を 「同一面内で」分割する 点源回折干渉偏光 ビームスプリッタ(PPBS)

偏光方向によって光線を 「反射と透過に」分割する

ワイヤグリッド型のPPBS



偏光方向	ピンホール内	ピンホール外
$\leftrightarrow$	反射	透過
<b>↓</b>	透過	反射



	eo光	oe光
偏光方向	$\leftrightarrow$	<b>1</b>



## <u>複素振幅測定PDI(caPDI)</u> PDIの0,πの干渉の代わりに参照光、被検光の強度 分布を測定→複素振幅(位相+振幅)測定









・入力した波面の位相を測定。

入力: Zernike 収差の8モード (tip/tilt, 非点x-y, defocus, コマ, 球面) 0—1.0 λ(P-V)まで

測定: PDIWFS  

$$\phi = \operatorname{atan}\left(\frac{I_{\pi/2} - I_{-\pi/2}}{I_0 - I_{\pi}}\right)$$
: caPDIWFS  

$$\phi = \operatorname{asin}\left(\frac{I_{\pi/2} - I_{-\pi/2}}{2\sqrt{I_{ref}I_{test}}}\right)$$

・各WFSの、各モードでの振る舞いは同じ
 ・caPDIは -λ/4:+λ/4で高精度測定可能
 ・PDIは-λ/2:+λ/2で測定可能
 両センサとも10%程度のずれがあるが、
 <λ/4の範囲で線形性が高いため、キャリブレーションが可能である。</li>





- 入射波面に(強度)振幅変化を与え、測定を模擬。
- 入力: 空間周波数2の強度変動



caPDI波面センサは振幅測定が振幅測定が可能 振幅の変動が大きくなると精度が悪化する。 →線形性の良い精度(10%以下)であれば、キャリブレーションできる。



消光比が悪化すると測定値/入力値の比が悪化。 →線形性は残っている(比が一定値)のでキャリブレーション可能



• 入射波の光子数の影響

各光子数、センサで26回シミュレーション

[検出面]を差し渡し24pixel,総pixel数449個に 分割。入射<mark>総光子数</mark>を変えて位相測定。







まとめ

- 0.1秒角、10<sup>7</sup>のコントラストを達成するための、高空間周波数(24素子)、高頻度(5-10kHz)、高精度(λ/20)のPDIセンサを定式化(今田+2015)。
- さらに高精度の複素振幅波面センサを構成、シミュレーションし、達成可能であることを確認した。→山本+2015

